(19) 世界知的所有權機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年1月27日(27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2005/009077 A1

H04R 19/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010042

(22) 国際出願日:

2004年7月14日(14.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-276009 2003年7月17日(17.07.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ホシデ ン株式会社 (HOSIDEN CORPORATION) [JP/JP]: 〒 5810071 大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号Osaka (JP), 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELEC-TRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂 五丁目3番6号 Tokyo (JP).

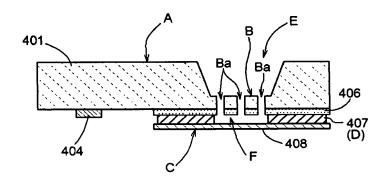
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大林義昭 (OHBAYASHI, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒6310045 奈良県 奈良市千代ヶ丘一丁目7-13 Nara (JP). 安田護 (YASUDA, Mamoru) [JP/JP]; 〒6512225 兵庫県神戸 市西区桜が丘東町五丁目 1 1-2 Hyogo (JP). 佐伯真 (SAEKI, Shinichi) [JP/JP]; 〒5820018 大阪府柏原 市大県三丁目 6-1 1 Osaka (JP). 駒井正嗣 (KOMAI, Masatsugu) [JP/JP]; 〒6620822 兵庫県西宮市松籟荘

/続葉有/

(54) Title: SOUND DETECTION MECHANISM

(54) 発明の名称: 音響検出機構



A: 基板

401: シリコン基板

B: 背電極

404: 電極部

(アコースティックホール)

406: 第2保護膜

C: 振動板

407: 犠牲層

408: 金属膜

D: スペーサ E: 音響開口

F: 空隙領域

A...SUBSTRATE

B...BACK ELECTRODE

Ba...THROUGH HOLE (ACOUSTIC HOLE)

C...DIAPHRAGM

D...SPACER

E...ACOUSTIC OPENING

F...SPACE AREA

401...SILICONE SUBSTRATE

404...ELECTRODE PART

406...SECOND PROTECTIVE FILM

407...SACRIFICE LAYER

408...METAL FILM

(57) Abstract: A sound detection mechanism allowing a diaphragm and rear electrodes to be formed on a substrate by a simple process. An acoustic hole forming through holes (Ba) is formed on the front surface side of the substrate (A), a second protective film (406), a sacrifice layer D (407), and a metal film (408) are laminated on the front surface side at the position of the acoustic hole, and etching is performed from the rear surface side of the substrate (A) to the depth of the acoustic hole to form an acoustic opening (E). Then, etching is performed from the rear surface side of the substrate (A) through the acoustic hole to remove the sacrifice layer (407) so as to form a space area (F) between the diaphragm (C) formed of the metal film (408) and the substrate (A) and to form the through holes (Ba), and the sacrifice layer (407) left after the etching is used as a spacer (D) keeping a distance between the back electrode (B) and the diaphragm (C).

基板に対して簡単 (57) 要約: なプロセスで振動板ならびに背 電極を作り出すことが可能な音 響検出機構を構成する。 Aの表面側に貫通穴Baを形成

するアコースティックホールを形成し、この表面側でアコースティックホールの部位に対して

- 3-16 Hyogo (JP). 加川健一 (KAGAWA, Kenichi) |JP/JP|; 〒6600891 兵庫県尼崎市扶桑町 1-8 東京エレクトロン株式会社内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 北村修一郎 (KITAMURA, Shulchiro); 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎五丁目 8 香 1 号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。